Mikroelektronika a technologie součáste			Jméno Jakub Charvot		ID <b>240844</b>	
Ústav mikroelektroniky				Ročník	Obor	Skupina
	FEK'	T VUT v Brně		3.	MET	MET/2
Spolupracoval		Měřeno dne	Odevzdáno dne		Hodnocení	
	_	23.10 2023	1	19.10. 2023		
Měření vlastností tlustovrstvých rezistorů						Č. úlohy <b>3</b>

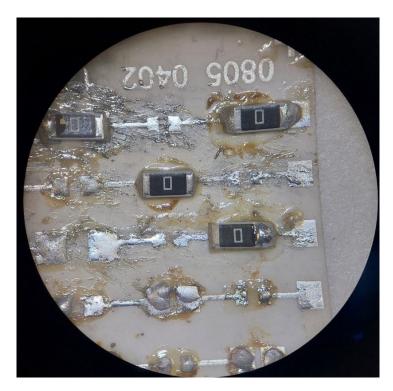
### 1 Teoretický úvod

:(

### 2 Praktická část

#### 2.1 Pracovní postup

Nejprve bylo potřeba očistit keramický substrát od starých součástek a zbytků pájecí slitiny. Následně mohla být dispenzerem nanesena pájecí pasta a do ní za pomocí vakuové pipety usazeny nové rezistory. K této úloze byla použita pájecí slitina SAC 305. Na základě ověřeného pájecího profilu (viz 2.3) jsme osazený substrát podrobili procesu pájení přetavením ve stejné pájecí peci. Následně jsme za pomoci optického mikroskopu zhodnotili kvalitu pájených spojů, ukázka je vidět na Obr. 1.



Obr. 1: Posouzení kvality pájeného spoje.

#### 2.2 Leaching

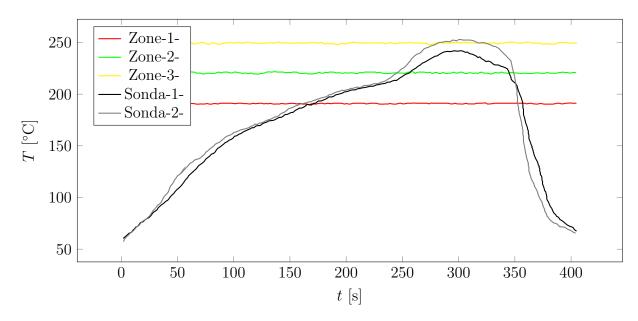
U tří různých pájecích past jsme testovali možnost vzniku leachingu při pájení přetavením. K testu byl použit keramický substrát na kterém je vodivý motiv vytvořen tiskem tlustovrstvé stříbrné pasty. Na stejný substrát byl umísten vzorek každé z pájecích past, onkrétně se jednalo o pasty Sn63Pb37, Sn42Bi58 a SAC305. K dosažení leatchingu jsme si pomohli vyšší teplotou, než je optimální pro tyto pasty, tedy cca 250°C. Výsledek našeho pozorování je vidět na Obr. 2



Obr. 2: Ukázka jevu leatching pro různé pájecí pasty.

#### 2.3 Měření teplotního profilu

U konvekční přetavovací pece (Essemtec RO 300FC) jsme testovali nastavení pájcího profilu. Zkouška probíhala za pomocí testovacího substrátu osazeného termočlánky připojenými k měřícímu přípravku. Změřený pájecí profil se nachází na Obr. 3, můžeme na něm vidět průbeh měřené teploty z obou termočlánků a také ze sensorů zabudovaných napevno v jednotlivých zónách pece, které by měly reflektovat nastavené teploty.



Obr. 3: Měřený teplotní profil.

# 3 Závěr

:(

## Reference